

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



Hoca PCIVPIO 09 FEB 2005 . BIJARIAR II 1889 B. 1997 (1910 - 1911 | 170 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |

(43) 国際公開日 2004年3月25日(25.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/025824 A1

H03B 5/32, G06G 7/20

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010853

(22) 国際出願日:

2003 年8 月27 日 (27.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-248932 2002年8月28日(28.08.2002) ЛР

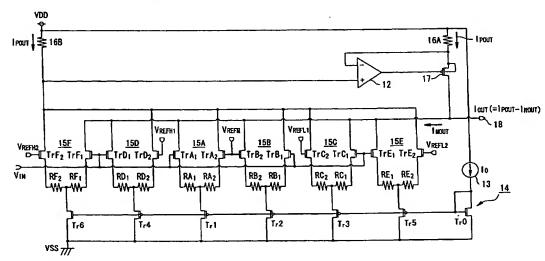
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭化 成マイクロシステム株式会社 (ASAHI KASEI MI-CROSYSTEMS CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒163-1031 東京都 新宿区西新宿三丁目7番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川崎 誉子 (KAWASAKI, Takako) [JP/JP]; 〒243-0004 神奈川県 厚木市 水引 1-1 2-2 0-1 0 3 Kanagawa (JP). 根 本 謙治 (NEMOTO, Kenji) [JP/JP]; 〒228-0804 神奈川 県 相模原市 旭町 2 2-1 O Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 森哲也, 外(MORI.Tetsuva et al.): 〒101-0032 東京都 千代田区 岩本町二丁目 3番 3号 友泉岩本町 ビル 8階 日栄国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続葉有/

(54) Title: DEVICE FOR GENERATING FUNCTION OF APPROXIMATE n-TH DEGREE AND TEMPERATURE COMPEN-SATION QUARTZ OSCILLATION CIRCUIT

(54) 発明の名称: 近似 n 次関数発生装置及び温度補償水晶発振回路



(57) Abstract: A circuit for generating a component of n-th degree includes: six differential amplifiers (15A to 15F) having a pair of input terminals supplied with a common linear input signal and a constant level signal of a predetermined level, outputting a reversed or non-reversed signal to the linear input signal, and having a limiter function to limit the output signal to a predetermined maximum value and a minimum value; a constant level signal generation circuit for supplying the constant level signal to each of the six differential amplifiers; a current mirror circuit (14) for controlling current flowing in the differential amplifiers (15A to 15F); and addition resistors (16A, 16B) for adding the output current of the differential amplifiers (15A to 15F). By increasing the flowing current by the sixth differential amplifier (15F) so as to increase the resistance value, it is possible to obtain a highly accurate output current of a component of a 5-th degree function having more precipitous inclination with respect to the input signal.

(57) 要約: 対の入力端子に共通の 1 次の入力信号及び所定レベルの定レベル信号が個別に入力され、前記 1 次の入 力信号に対して反転又は非反転信号を出力すると共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッタ機 能を有する複数6個の差動増幅器15A~





SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明細書

近似n次関数発生装置及び温度補償水晶発振回路

技術分野

5 本発明は、近似n次関数を発生する近似n次関数発生装置及びこれを使用した 温度補償型水晶発振回路に関する。

背景技術

15

20

25

水晶発振器に多く用いられるATカットの水晶振動子は、固定の固有共振周波 10 数に対する温度変化が図17に示すように近似3次関数で表されることが知られ ており、この温度特性は下記(1)式のように近似することができる。

$$Y = \alpha (t - t_0)^3 + \beta (t - t_0) + \gamma \qquad \cdots \qquad (1)$$

ここで、Yは出力周波数であり、 α は 3 次の係数、 β は温度特性の傾き、 γ は周波数オフセットであり、t 。は曲線の中心温度、即ち変曲点(通常 25 $\mathbb C$ から 30 $\mathbb C$ の範囲)である。上記(1)式の α 、 β 及び γ は夫々水晶振動子に大きく依存する。

このため、従来は、例えば特許第3233946号に記載されているような近似3次関数発生装置からの出力電圧を用いて温度補償するようにしていた。

すなわち、図18に示すように、温度変化に対して1次的に変化する電圧を出力する温度検出回路から出力される電圧V_{IN}を入力信号として近似3次関数を発生する近似3次関数発生装置の出力を水晶の温度特性を補償する制御電圧とし、これを電圧制御水晶発振器(VCXO)に供給する。

現在広く適用されている電圧制御水晶発振回路の電圧-周波数特性は1次関数で近似できるので、水晶振動子の温度に対する周波数特性は、図19に示すように、温度に対する電圧特性で近似できる。

この制御電圧の電圧-温度特性は、下記(2)式のようになる。

$$f(t) = a_3 (t-t_0)^3 + a_1 (t-t_0) + a_0 \cdots (2)$$

すなわち、上記(2)式の制御電圧と一致する電圧を、近似3次関数発生装置より発生させ、電圧制御水晶発振器に入力することで、水晶振動子の温度特性を補

償することができる。

しかし、水晶振動子の周波数ー温度特性には、3次成分よりも大きな次数成分 が含まれているため、近似した3次関数とデータとの間には差異があり、厳密に 近似3次関数を補正できるような制御電圧を発生させたとしても、この差異は温 度補償できない要素として残ってしまう。

これを解決するために、水晶振動子の温度特性をより高次の関数で近似し、それに対応する高次関数の電圧で電圧制御水晶発振器を制御すれば、この誤差を減らすことが可能である。

例えば、ある一つの水晶振動子の周波数-温度特性データを3次関数で近似した場合、近似式とデータとの差は、温度範囲-30℃~85℃において、最大0.320ppmである。これを4次関数で近似すると0.130ppm、さらに5次式に近似すると0.126ppmとなり、より高次関数を発生する装置を用いて係数を調整して制御電圧を生成すれば、より精度良く水晶の温度補償を行うことができる。

15 これまでに、3次もしくはそれ以上の高次関数に比例する信号を出力する回路 としては、例えば特開平8-116214号公報の図1に示されているような関 数発生装置が知られている。

この回路から出力される信号は、一般式として下記(3)式のような多項式で表すことができる。

20
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

= $a_n' (x - x_0)^n + \dots + a_1' (x - x_0) + a_0' \dots$ (3)

例えば、4次関数発生装置の出力信号は、下記(4)式で表すことができる。

但し、 $a_4' = a_4$, $a_2' = a_2 - 6 a_4 x_0^2$, $a_1' = a_1 + 2 a_2 x_0 - 8 a_4 x_0^3$, $a_0' = a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 - 3 a_4 x_0^4$ であり、 $x_0 = -a_3 / (4 a_4)$ である

近似 4 次関数発生装置は上記 (4) 式のように x。を用いると、n-1 次の項、

15

20

25



即ち3次の項を省略することができ、回路規模も縮小化できる。

しかしながら、上記従来例にあっては前記 (4)式のような構成で制御電圧を 生成する回路は、実現し難いという未解決の課題がある。

この未解決の課題を、具体的例を用いて説明する。ある水晶振動子の周波数ー温度特性データを先ず、上記(4)式のように 3次の項を省略した式で記述すると、この関数の変曲点を表す t_0 は、-149 Cとなり、通常補償されている温度範囲 -30 C~85 Cの範囲を大きく越えてしまう。 t_0 の大きなずれは、これに相当する制御電圧を生成する関数回路の入力範囲を広く持たなくてはならないことを意味し、調整範囲外の温度を考慮した回路にしなくてはならない。また、各次数の成分を図示すると図 20 のようになり、水晶振動子の周波数 - 温度特性が ± 10 p p m以内に入るのに対して、各次数成分は最大 ± 1500 p p m という大きな振れ幅を持つ関数を加算したものになっていることが分かる。よって、上記の水晶振動子の周波数 - 温度特性を補償するためには、制御電圧として各次数の係数 a_4 ' ~ a_0 ' の調整範囲を幅広く持たなくてはならず、これを実現する回路はダイナミックレンジとして非常に不利になる。この結果、制御電圧として 3 次関数から 4 次関数に拡張したことによって、大幅なノイズの増大や回路規模の拡大という問題が生じ、精度を挙げるという利益があることを考慮しても、実用的ではないと言える。

そこで、本発明は、上記従来例の未解決の課題に着目してなされたものであり、温度補償電圧の3次以上の高次成分を、精度良く提供する回路及びその関数発生装置を温度補償のために用いた精度良く調整できる水晶発振器を提供することを目的としている。

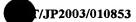
発明の開示

本発明による請求の範囲第1項記載のk次成分発生回路は、一方の入力端子に 共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所定レベルの定レベル信号 が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反転信号を出力すると共に 、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッタ機能を有する複数i個 (iは5以上の整数)の差動増幅器と、前記i個の差動増幅器に前記定レベル信

10

15

25



号を夫々供給する定レベル信号発生回路とを備え、前記 i 個の差動増幅器のうち 第1、第2及び第3の差動増幅器は、入力される定レベル信号が順にレベルが高 くなるように設定されると共に、前記第1及び第3の差動増幅器と前記第2の差 動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、前記i個の差動増幅器のうち 第4差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第2の差動増幅器に入力され る定レベル信号と同レベルの信号に設定されていると共に、その出力信号が前記 第1及び第3の差動増幅器の出力信号と同極性で且つ前記最大値となる入力信号 と前記最小値となる入力信号との幅が前記第2の差動増幅器のそれより大きく設 定され、前記i個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器以 外の (i-4) 個の差動増幅器の夫々は、入力される定レベル信号が前記第1の 差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなる及び前記第3の差動 増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるの何れかに設定されてい ると共に、前記 (i-4) 個の差動増幅器と前記第2の差動増幅器との出力信号 が互いに逆極性に設定され、前記第1、第2、第3及び前記(i-4)個の差動 増幅器の出力信号を加算したときにk(kは3以上の奇数)次関数成分の出力信 号を形成するように構成され、前記第4の差動増幅器は前記n次関数成分の1次 成分を相殺するような1次成分の出力信号を形成するように構成され、前記i個 の差動増幅器の出力信号を加算することにより、1次成分を含まないk次関数成 分を発生させることを特徴としている。

20 これによれば、(i-4)個の差動増幅器の通電電流値を調整して入力信号が 最大値より大きい又は最小値より小さい範囲において入力信号に対してより急峻 な傾きの出力信号を形成することが可能となり、高精度の近似k(kは3以上の 奇数)次関数を発生することができる。

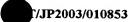
また、本発明による請求の範囲第2項記載の3次成分発生回路は、請求の範囲 第1項において、i=5且のk=3に設定されていることを特徴としている。

これによって、k次の奇数次成分発生回路の中でも3次に特化した回路を構成することができ、高精度の3次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第3項記載の3次成分発生回路は、請求の範囲 第2項において、第5の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第1の差

20

25



動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなるように設定され且つ前 記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第1の差動増 幅器のそれより小さく設定されていることを特徴としている。

これによって、入力電圧の範囲を変曲点から高い側にのみ広げた場合に、精度 5 の良い3次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第4項記載の3次成分発生回路は、第5の差動 増幅器は、入力される定レベル信号が前記第3の差動増幅器に入力される定レベ ル信号のレベルより高くなるように設定され且つ前記最大値となる入力信号と前 記最小値となる入力信号との幅が前記第3の差動増幅器のそれより小さく設定さ れていることを特徴としている。

これによって、入力電圧の範囲を変曲点から低い側にのみ広げた場合に、精度 の良い3次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第5項記載の3次成分発生回路は、請求の範囲 第1項において、i=6及びk=5に設定されていることを特徴としている。

15 これによって、k次の奇数次成分発生回路の中でも5次に特化した回路を構成 することができ、高精度の5次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第6項記載の5次成分発生回路は、請求の範囲第5項において、前第5の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなるように設定され且つ前記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第1の差動増幅器のそれより小さく設定され、第6の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第3の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるように設定され且つ前記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第3の差動増幅器のそれより小さく設定されていることを特徴としている。

これによって、入力電圧の範囲を変曲点から高い側にのみ広げた場合に、精度 の良い5次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第7項記載のm次成分発生回路は、一方の入力 端子に共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所定レベルの定レベ ル信号が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反転信号を出力する

10



と共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッタ機能を有する複数 j 個 (j は 4 以上の整数) の差動増幅器と、一定の出力信号を出力する一定信号出力回路と、前記 j 個の差動増幅器に前記定レベル信号を夫々供給する定レベル信号発生回路とを備え、前記 j 個の差動増幅器のうち第 1、第 2、第 3 及び第 4 の差動増幅器は、入力される定レベル信号が順にレベルが高くなるように設定されると共に、前記第 1 及び第 2 の差動増幅器と前記第 3 及び第 4 の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、前記 j 個の差動増幅器の出力信号を加算したときにm (mは 4 以上の偶数) 次関数成分の出力信号を形成するように構成され、前記一定信号出力回路は、前記m次関数成分の 0 次成分を相殺するような 0 次成分の出力信号を形成するように構成され、前記 j 個の差動増幅器及び前記一定信号出力回路の出力信号を加算することにより、 0 次成分を含まないm次関数成分を発生させることを特徴としている。

これによって、0次成分を含まない偶数m次成分のみを高精度に発生することができる。

15 また、本発明による請求の範囲第8項記載のm次成分発生回路は、請求の範囲第7項において、jが6以上の偶数であって、j個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器以外の(j-4)の差動増幅器の夫々は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなる及び前記第4の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるの何れかに設定されていることを特徴としている。

これによって、(j-4)個の差動増幅器の通電電流値を調整して入力信号が最大値より大きい又は最小値より小さい範囲において入力信号に対してより急峻な傾きの出力信号を形成することが可能となり、高精度の近似m次関数を発生することができる。

25 また、本発明による請求の範囲第9項記載の4次成分発生回路は、請求の範囲 第7項において、j=4且つm=4に設定されていることを特徴としている。

これによって、m次の偶数次成分発生回路の中でも4次に特化した回路を構成することができ、高精度の4次関数を出力することができる。

また、本発明による請求の範囲第10項記載の近似n次関数発生装置は、一定

10

15

20

25



の信号が入力されて定数成分を発生する 0 次成分発生部と、 1 次の入力信号が入力されて 1 次成分を発生する 1 次成分発生部と、前記 1 次の入力信号が入力される k (kは 3 以上の奇数) 次成分発生回路及び該 k 次成分発生回路の出力信号が入力される第 1 の可変利得増幅回路を有する少なくとも 1 つ以上の k 次成分発生 部と、前記 1 次の入力信号が入力される m (mは 4 以上の偶数) 次成分発生回路及び該m次成分発生回路の出力信号が入力される第 2 の可変利得増幅回路を有する少なくとも 1 つ以上のm次成分発生部と、前記 0 次成分発生部、前記 1 次成分発生部、前記 k 次成分発生部及び前記m次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備え、近似 n (n は 4 以上の整数) 次関数を発生することを特徴としている。

これによって、2次の項を省略して3次成分を主としてその変曲点に近い変曲 $点 x_0$ を用いることができると共に、3次以外の $n \ge 4$ におけるn 次成分が小さくなるために、構成としては共通の変曲点 x_0 を用い、オフセット+1次成分+3次成分+補正用高次成分という構成で実現できるため回路規模に与える影響を小さくすることができる。

また、本発明による請求の範囲第11項記載の近似n次関数発生装置は、一定の信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項1に記載のk(kは3以上の奇数)次成分発生回路及び該k次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利得増幅回路を有する少なくとも1つ以上のk次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項7に記載のm(mは4以上の偶数)次成分発生回路及び該m次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する少なくとも1つ以上のm次成分発生部と、前記0次成分発生部、前記1次成分発生部、前記k次成分発生部及び前記m次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備え、近似n(nは4以上の整数)次関数を発生することを特徴としている。

これによって、2次の項を省略して高精度に発生することができる3次成分を 主としてその変曲点に近い変曲点xoを用いることができると共に、3次以外のn ≥4におけるn次成分が小さくなるために、構成としては共通の変曲点xoを用い

15

20

25



、オフセット+1次成分+3次成分+補正用高次成分という構成で実現できるため回路規模に与える影響を小さくすることができる。

また、本発明による請求の範囲第12項記載の近似3次関数発生装置は、一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利得増幅回路を有する3次成分発生部と、前記0次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記3次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備えていることを特徴としている。

これによって、髙精度の近似3次関数を発生させることができる。

また、本発明による請求の範囲第13項記載の近似4次関数発生装置は、一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利得増幅回路を有する3次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項9に記載の4次成分発生回路及び該4次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する4次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する4次成分発生部と、前記4次成分発生部、前記3次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記0次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備えていることを特徴としている。

これによって、髙精度の近似4次関数を発生させることができる。

また、本発明による請求の範囲第14項記載の近似5次関数発生装置は、一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利得増幅回路を有する3次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項9に記載の4次成分発生回路及び該4次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する4次成分発生部と、前記1次の入力信号が入力される上記請求項5又は請

求項6に記載の5次成分発生回路及び該5次成分発生回路の出力信号が入力される第3の可変利得増幅回路を有する5次成分発生部と、前記5次成分発生部、前記4次成分発生部、前記3次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記0次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備えていることを特徴としている。

5 これによって、高精度の近似5次関数を発生することができる。

また、本発明による請求の範囲第15項記載の近似n次関数発生装置は、1次の入力信号が入力され、n次多項式により表されるn次関数に比例するn次の出力信号を出力し、前記n次多項式は2次の項を含まないことを特徴としている。

これによって、3次成分を主としてその変曲点に近い変曲点xoを用いることができると共に、3次以外のn≥4におけるn次成分が小さくなるために、構成としては共通の変曲点xoを用い、オフセット+1次成分+3次成分+補正用高次成分という構成で実現できるため回路規模に与える影響を小さくすることができる

また、本発明による請求の範囲第16項記載の温度関数発生回路は、温度検出 15 回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される上記請求項15に記載の近似n 次関数発生装置とを備えたことを特徴としている。

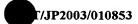
これによって、温度検出回路の検出信号を近似 n 次関数発生装置に入力信号として供給することができ、水晶の温度特性を補正する電圧を発生することが可能な温度関数発生回路を構成することができる。

20 また、本発明による請求の範囲第17項記載の温度補償水晶発振回路は、上記 請求項16に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似 n次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴としている。

これによって、髙精度で温度補償を行うことができる温度補償水晶発振回路を 構成することができる。

25 また、本発明による請求の範囲第18項記載の温度関数発生回路は、温度検出 回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項10又は11に記載 の近似n次関数発生装置とを備えたことを特徴としている。

これによって、高精度の近似n次関数発生装置を使用して水晶の温度特性を補 正する電圧を発生することが可能な温度関数発生回路を構成することができる。



また、本発明による請求の範囲第19項記載の温度補償水晶発振回路は、上記請求項18に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似n次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴としている。

これによって、高精度で温度補償を行うことができる温度補償水晶発振回路を 5 構成することができる。

また、本発明による請求の範囲第20項記載の温度関数発生回路は、温度検出 回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項12に記載の近似3 次関数発生装置とを備えたことを特徴としている。

これによって、3次関数に特化した温度関数発生回路を構成することができる 10。

また、本発明による請求の範囲第21項記載の温度補償水晶発振回路は、上記請求項20に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似3次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴としている。

これによって、3次関数に特化した温度補償水晶発振回路を構成することがで 15 きる。

また、本発明による請求の範囲第22項記載の温度関数発生回路は、温度検出 回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項13に記載の近似4 次関数発生装置とを備えたことを特徴としている。

これによって、4次関数に特化した温度関数発生回路を構成することができる 20 。

また、本発明による請求の範囲第23項記載の温度補償水晶発振回路は、上記請求項22に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似 4次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴としている。

これによって、4次関数に特化した温度補償水晶発振回路を構成することがで 25 きる。

また、本発明による請求の範囲第24項記載の温度関数発生回路は、温度検出 回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項14に記載の近似5 次関数発生装置とを備えたことを特徴としている。

これによって、5次関数に特化した温度関数発生回路を構成することができる

15

20

また、本発明による請求の範囲第25項記載の温度補償水晶発振回路は、上記請求項24に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似 5次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴としている。

5 これによって、5次関数に特化した温度補償水晶発振回路を構成することがで きる。

また、本発明による請求の範囲第26項記載の温度補償調整方法は、温度検出回路及び近似n(nは3次以上の整数)次関数発生装置を備える温度補償回路と、電圧制御水晶発振回路とから構成される温度補償水晶発振回路において、前記温度補償水晶発振回路の温度補償調整を行う際に、所定の温度雰囲気内で、前記温度補償回路の出力電圧VCourのn次成分VCourn乃至0次成分VCouroを測定すると共に、前記電圧制御水晶発振回路から出力される発振周波数が予め設定された選定周波数に一致する入力電圧VCINを所望の温度補償範囲内における複数の温度で測定し、測定した各温度の出力電圧VCourのn次成分VCournを温度Tの関数として、

$$VC_{out_n}'$$
 (T) $= VC_{out_n}$ (T) $-VC_{out_n}$ (T)

で近似し、前記出力電圧VComを温度Tの関数として、

$$VC_{OUT} (T) = \alpha_{n} VC_{OUTn}' (T + \Delta T) + \cdots$$

$$+ \alpha_{3} VC_{OUT3}' (T + \Delta T) + \alpha_{1} VC_{OUT1}' (T + \Delta T)$$

$$+ VC_{OUT0}' (T + \Delta T) + \alpha_{0}$$

で表記し、前記測定された各温度の入力電圧 VC_{IN} と前記出力電圧 VC_{OUT} とが夫々の温度において一致するように、前記温度補償回路の係数 $\alpha_n \sim \alpha_3$ 、 α_1 、 α_0 及び Δ Tを調整するようにしたことを特徴としている。

これによって、高精度な温度補償が可能となるという効果が得られる。しかも、各次数を個別に測定することにより、詳しく正確なデータの取得が可能になり、実際のデータを基にすることで、各次数成分以外のエラーなども考慮して、より最適な係数の算出が可能となり、さらに、一度の温度スイープによって、これまでに知られている近似3次関数回路ばかりか、n≥4における近似n次関数発生回路においても、温度補償の調整を精度良く行うことが可能になる。



図面の簡単な説明

図1は本発明を温度補償水晶発振回路に適用した場合の一実施形態を示すブロ ック図である。図2は近似5次関数発生装置を適用した温度補償水晶発振回路の 具体例を示すブロック図である。図3は近似4次関数発生装置を適用した温度補 償水晶発振回路の具体例を示すブロック図である。図4は図1のn次成分発生部 の一例を示す回路図である。図5は図4に適用し得る5次成分発生回路の一例を 示す回路図である。図6は図5の5次成分発生回路の動作の説明に供する基本回 路図である。図7は図5の5次成分発生回路の一部分の動作の説明に供する各差 動対の出力特性を示す特性線図である。図8は図5の出力波形図である。図9は 10 図5の5次成分発生回路の動作の説明に供する出力波形図である。図10は図4 に適用し得る4次成分発生回路の一例を示す回路図である。図11は図10の4 次成分発生回路の動作の説明に供する出力波形図である。図12は図4に適用し 得る3次成分発生回路の基本的部分を示した回路図である。図13は図12の3 次成分発生回路の基本的部分の動作の説明に供する出力波形図である。図14は 15 入力電圧範囲を拡張した時に適する3次成分発生回路の一例を示す回路図である 。図15は図14の3次成分発生装置の動作の説明に供する出力波形図である。 図16は図1~図3に適用し得る1次関数発生部を示すブロック図である。図1 7は水晶振動子の温度に対する周波数特性図である。図18は従来例を示すプロー ック図である。図19は電圧制御水晶発振器に入力する制御電圧の温度特性であ 20 る。図20は従来の近似式の特性を表す特性線図である。図21は本発明の近似 式の特性を表す特性線図である。

発明を実施するための最良の形態

25 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

先ず、本発明の近似n次関数発生装置の原理を説明する。

n次関数は一般に、下記(5)式のように表すことができる。

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$
$$= a_n' (x - x_0)^n + a_{n-1}' (x - x_0)^{n-1} + \dots$$

$$+ a_3' (x - x_0)^3 + a_1' (x - x_0) + a_0' \cdots (5)$$

具体的一例として、5次関数においては、下記(6)式のように表せる。

$$f(x) = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$= a_{5}' (x - x_{0})^{5} + a_{4}' (x - x_{0})^{4} + a_{3}' (x - x_{0})^{3}$$

この(6)式において、係数の関係は、

 $a_{5}'=a_{5}$

5

 $a_4' = a_4 + 5 a_5 x_0$

 $a_3' = a_3 + 4 a_4 x_0 + 1 0 a_5 x_0^2$

10 $a_1' = a_1 - 3 a_3 x_0 - 8 a_4 x_0^3 - 1 5 a_5 x_0^4$

 $a_0' = a_0 + a_1 \times a_0 - 2 a_3 \times a_0^3 - 5 a_4 \times a_0^4 - 9 a_5 \times a_0^5$

但し、xoは以下の3次方程式の解である。

 $10 a_5 x_0^3 + 6 a_4 x_0^2 + 3 a_3 x_0 + a_2 = 0$

この x_0 については、解が1つ又は3つ得られるが、想定している値に近いものを 選ぶことにする。この変換により、上記(6)式の x_0 は"29"となり、通常補償 されている温度範囲の中心付近の、同じデータを3次関数に近似した時の変曲点 と略等しくなり、3次成分が主成分であり、4次及び5次成分は小さくなり、回 路構成として有利なものとなる。

また、4次関数においては、下記(7)式のように表せる。

20
$$f(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$= a_4' (x - x_0)^4 + a_3' (x - x_0)^3$$

この(7)式において、係数の関係は、

 $a_4'=a_4$

 $a_3' = a_3 + 4 a_4 x_0$

 $a_1' = a_1 - 3 a_3 \times 0^2 - 8 a_4 \times 0^3$

 $a_0' = a_0 + a_1 \times 0 - 2 a_3 \times 0^3 - 5 a_4 \times 0^4$

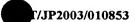
但し、xoは以下の2次方程式の解である。

 $6 a_4 x_0^2 + 3 a_3 x_0 + a_2 = 0$

15

20

25



この x_0 については解が2つ得られるが、曲線の中心に近い方を選ぶことにする。この結果、 x_0 は"31"で、通常補償されている温度範囲の中心付近の、同じデータを3次関数に近似した時の変曲点と略等しくなる。さらに、上記と同様に(7)式で表した時の各次数成分を図示すると図21のようになり、4次成分は ± 3 p p m以内となる。このように上記(6)式又は(7)式のように2次成分のない式で表すと、主成分が3次及び1次成分であり、その3次関数の変曲点と略等しい変曲点を持つごく僅かな高次の成分を付加したものとなり、これに相当する制御電圧を発生する回路のダイナミックレンジとして非常に有利な構成となる。

図1は本発明に係る温度補償水晶発振回路の一実施形態を示すブロック図であ 10 る。

図中、1は温度変化に対して1次関数的にアナログ出力電圧が変化する温度検出回路であり、この温度検出回路1から出力されるアナログ電圧による温度検出値を入力信号VINとして近似n次関数発生装置2に入力して水晶の温度特性を補償する電圧を発生し、これを電圧制御水晶発振器(VCXO)3に供給する。

ここで、近似n次関数発生装置 2 は、前述した(5)式のn次関数で表される電圧を発生するものであり、入力信号 V_{IN} が入力され、これに基づいて前述した(5)式における第1項のn次成分のみを発生するn次成分発生部6n、(5)式におけるn-2項の3次成分のみを発生する3次成分発生部6B及び(5)式におけるn-1項の1次成分のみを発生する1次成分発生部6Aと、n次成分発生部6n、……3次成分発生部6B及び1次成分発生部6Aの出力信号を加算する加算回路4とで構成されている。

この近似n次関数発生装置2としては、nを任意の高次数に設定することができるものであるが、具体例としては、図2に示すような近似5次関数発生装置2A又は図3に示すような近似4次関数発生装置を適用して温度補償水晶発振回路を構成する。

すなわち、図2の温度補償水晶発振回路では、近似5次関数発生装置2Aが前述した図1の構成における加算回路4、0次成分発生部5、1次成分発生部6A、3次成分発生部6Bに加えて、4次成分発生部6C及び5次成分発生部6Dが設けられ、1次成分発生部6A、3次成分発生部6B、4次成分発生部6C及び

20

25



5次成分発生部6Dの出力信号が加算回路4で加算されるように構成されている

また、図3の温度補償水晶発振回路では、近似4次関数発生装置2Bが、図2の構成における5次成分発生部6Dを省略した構成とされている。

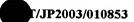
5 そして、図1〜図3における3次成分発生部6B、4次成分発生部6C、5次成分発生部6D、……n次成分発生部6nの夫々は、図4に示すように、3、4、5……n次成分のうちの各次数成分のみを発生するn次成分発生回路9と、このn次成分発生回路9の出力が入力される可変利得増幅回路11と、n次成分発生回路9に後述する定レベル信号VREFL1〜VREFH2を供給する定レベル信号発生10 回路20とで構成されている。

ここで、奇関数回路の一例として5次成分発生回路について説明する。

5次成分発生回路は、図5に示すように、正の電源端子VDDに定電流源13を介してゲート及びドレインを接続し、ソースをVSSに接地したMOS型電界効果トランジスタTr0のゲートに各ゲートを接続した6個のMOS型電界効果トランジスタTr1~Tr6とを備えたカレントミラー回路14と、このカレントミラー回路14から定電流が供給される第1~第6の増幅器を構成する6個の差動増幅器15A~15Fと、これらの差動増幅器15A~15Fと、これらの差動増幅器15A~15Fの出力電流を加算する加算器を構成する同一抵抗値を有する抵抗16A,16B及び出力の電流差分を得るための差動増幅器12とから構成されている。各差動増幅器15A~15Fには低レベル信号発生回路20から異なる定レベルの参照電圧VREFH1、VREFH2、VREFM、VREFL2及びVREFL1が供給される。

ここで、差動増幅器 15 Aは、カレントミラー回路 14 のMO S型電界効果トランジスタ T r 1 のドレインに夫々抵抗 R A_1 及び R A_2 を介して直列に接続された M O S型電界効果トランジスタ T r A_1 及び T r A_2 を有し、トランジスタ T r A_1 のゲートに入力信号 V_{IN} が供給されると共に、トランジスタ T r A_2 のゲートに定レベルの参照電圧 V_{REFM} が供給され、トランジスタ T r A_1 のドレインが加算器を構成する一方の抵抗 16 A及び差動増幅器 12 の出力をゲートで受ける M O S型電界効果トランジスタ 17 を介して正の電源端子 M VD D に接続され、トラ

20



ンジスタTrA2のドレインが加算器を構成する他方の抵抗16Bを介して正の電源端子VDDに接続されている。

差動増幅器 15Bも同様に、カレントミラー回路 14のMOS型電界効果トランジスタTr 1のドレインに夫々抵抗RB₁及びRB₂を介して直列に接続されたMOS型電界効果トランジスタTrB₁及びTrB₂を有する。そして、トランジスタTrB₁のゲートに入力信号 $V_{\rm IN}$ が供給されると共に、トランジスタTrB₂のゲートに定レベルの参照電圧 $V_{\rm REFM}$ が供給される。しかし、前述した差動増幅器 15Aとは逆にトランジスタTrB₁のドレインが加算器を構成する他方の抵抗 16Bを介して正の電源端子 $V_{\rm ID}$ Dに接続され、トランジスタTrB₂のドレインがMOS型電界効果トランジスタ 17と加算器を構成する一方の抵抗 16Aとを介して正の電源端子 $V_{\rm ID}$ Dに接続されることにより、他の差動増幅器 15A、15C、15D、15E及び 15Fとは逆特性に設定されている。

差動増幅器 15C、 15D、 15E及び 15Fも、 差動増幅器 15Aと同じ構成であり、夫々定レベル信号発生回路 20で発生される参照定電圧 V_{REFL1} 、 V_{REFH1} 、 V_{REFL2} 及び V_{REFH2} が入力されている。そして、 MOS型電界効果トランジスタ TrA_1 、 TrB_2 、 TrC_1 、 TrD_1 、 TrE_1 及び TrF_1 は、 MOS型電界効果トランジスタ TrA_1 、 TrB_2 、 TrD_1 、 TrE_1 及び TrF_1 は、 TrE_1 及び TrF_1 は、 TrE_1 及び TrF_1 は、 TrE_1 及び TrF_1 は、 TrE_1 及び TrE_1 と接続され 、 その接続点が演算増幅器 TERETAL で TERETAL で TRETAL と TRETAL で TRETAL と TRETAL で TRETAL TRETAL で TRETAL T

なお、各差動増幅器 $15A\sim15$ Fに供給される参照定電圧 $V_{REFH1}\sim V_{REFL1}$ の大きさは、 $V_{REFH2}>V_{REFH1}>V_{REFM}>V_{REFL1}>V_{REFL2}$ に設定され、差動増幅器 15 Bにも差動増幅器 15 Aと同電圧の参照定電圧 V_{REFM} が供給されている

そして、抵抗16A及び16Bを流れる正転出力電流Ipourと各差動増幅器15A~15FのMOS型電界効果トランジスタTrA1~TrF1、抵抗RA1~RF1及びMOS型電界効果トランジスタTr1~Tr6を介して接地VSSに流れる反転出力電流Inourとの差分電流が出力電流Iourとして5次成分発生回路の出力端子18から出力される。この出力電流Iourが可変利得増幅回路11を構成する負帰還に可変抵抗VRを介挿したオペアンプOPAの反転入力側に供給され、このオペアンプOPAの正転入力側に定電圧発生回路10で発生される

15

20

25



定電圧Voffが供給され、このオペアンプOPAから下記(8)式で表される1次 成分を含まない5次成分のみの出力V5ourを得ることができる。

 $V = B = S (V_{IN} - V_{OFF})^{5}$ (8)

ここで、係数B5は5次成分発生回路のゲイン及び可変利得増幅回路の利得によ 5 って決定される。

次に、上記5次成分発生回路の動作を説明する。

このため、カレントミラー回路 14の定電流値を I_0 とすると、MOS型電界効果トランジスタT r C_2 を流れる電流 $I_{C2} = I_0$ 、MOS型電界効果トランジスタT r C_1 を流れる電流 $I_{C1} = 0$ となる。このため、電流 I_{NOUT} 及び I_{POUT} は図 7 (a) の破線図示及び実線図示のように I_0 及び 0 となる。

この状態から、入力電圧 V_{IN} が増加して、参照定電圧 V_{REFL1} から抵抗R C_2 での電圧降下分 I_0 ・R C_2 を減算した V_{CL} を越えると出力電流 I_1 C_2 が徐々に滑らかに減少し、これと対称的に出力電流 I_1 C_1 が徐々に滑らかに増加し、入力電圧 V_{IN} が参照定電圧 V_{REFL1} に等しくなると両出力電流 I_1 C_2 が等しくなる。さらに入力電圧 V_{IN} が上昇すると、出力電流 I_1 C_2 は減少傾向を維持し、出力電流 I_1 C_2 は増加傾向を維持し、参照電圧 V_{REFL1} に抵抗R I_1 の電圧降下分 I_2 I_3 I_4 I_5 I_5

結局、図7 (b) の出力特性において、抵抗 RC_1 及び RC_2 の抵抗値RCとカレントミラー回路14の定電流値 I_0 とによってのみ決定されるトランジスタの特性によるものは、 $V_{REFL1}\pm I_0$ ・R C付近の滑らかな出力変化のみとなる。

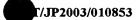
次に、図5の5次成分発生回路の動作説明を簡略化するため、差動増幅器15A、15E、15Fを除外した回路について考察する。入力電圧Vが参照定電圧 V_{REFL1} より十分に小さい時($V_{IN} \ll V_{REFL1}$)には、前述したように差動増幅器15CにおいてはMOS型電界効果トランジスタTr 3を流れる電流は全TMO

10

15

20

25



S型電界効果トランジスタTr C_2 を流れ、結果として $I_{C2}=I_0$ 、 $I_{C1}=0$ となる。同様に差動増幅器 $I_{5}B$ 、 $I_{5}D$ においても、 $I_{B2}=I_{D2}=I_0$ 、 $I_{B1}=I_{D1}=0$ となり、加算された電流 $I_{POUT}=2I_0$ 及び $I_{NOUT}=I_0$ となる。

そして、入力電圧 V_{IN} が増加すると、これに応じてMOS型電界効果トランジスタ TrC_2 に $PTrC_1$ に電流が流れ始めると共に、 $PTrC_2$ に 流れる電流が減少し始め、入力電圧 $PTrC_2$ に 流れる電流が減少し始め、入力電圧 $PTrC_2$ に 下に $PTrC_2$ に $PTrC_2$ に PT

さらに入力電圧 V_{IN} が増加すると、差動増幅器 15BのMOS型電界効果トランジスタ TrB_1 に電流が流れ始めると共に、MOS型電界効果トランジスタ TrB_2 の電流が減少し始め、入力電圧 V_{IN} が参照定電圧 V_{REFM} に達すると $I_{B1}=I_{B2}=I_0/2$ となり、出力電流 I_{POUT} 及び I_{NOUT} は再び $I_{NOUT}=I_{POUT}=3I_0/2$ となる。

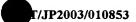
 $I_{POUT}=2I_0$ 、 $I_{NOUT}=I_0$ となった後、さらに出力電圧 V_{IN} が増加すると、 差動増幅器 $1.5\,D$ のMO S型電界効果トランジスタ $T_r\,D_1$ に電流が流れ始める と共に、MO S型電界効果トランジスタ $T_r\,D_2$ の電流が減少し始め、入力電圧 V_{IN} が参照定電圧 V_{REFH1} に達すると、出力電流 I_{POUT} 及び I_{NOUT} は再び $I_{POUT}=I_{NOUT}=3I_0$ /2となり、さらに入力電圧 V_{IN} が増加すると、 $I_{POUT}=I_0$ 、 $I_{NOUT}=2I_0$ となる。

したがって、例えば I_{NOUT} 側について見ると、第3の差動増幅器 I_{SCO} の出力電流 I_{CI} は図 I_{CI} は図 I_{CI} で一点鎖線図示のように、入力信号 I_{IN} の電圧が第3の差動増幅器 I_{SCO} 最小値 I_{CI} に達するまでの間は I_{SCO} を維持し、最小値 I_{CI} を越えると増加し始め、参照定電圧 I_{REFL1} に達すると I_{IO} / I_{IO} となり、その後も入力信号 I_{IN} の電圧増加に応じて増加し、最大値 I_{IO} に達して飽和する。

また、第2の差動増幅器15Bの出力電流 I_{B2}は、図8で破線図示のように、 入力信号 V_{IN}の電圧が、第2の差動増幅器15Bの最小値 V_{BL}(本実施形態におい

20

25



ては V_{CH} と等しい値に設定されている)に達するまでは I_0 を維持し、最小値 V_{BL} を越えると減少し始め、参照定電圧 V_{REFM} に達すると I_0 / 2 となり、その後も入力信号 V_{IN} の電圧増加に応じて減少し、最大値 V_{BH} 以上になると 0 を維持する。

さらに、第5の差動増幅器15Dの出力電流 I_{DI} は、図8で実線図示のように、入力信号 V_{IN} の電圧が第4の差動増幅器15Dの最小値 V_{DL} (本実施形態においては V_{BH} と等しい値に設定されている)に達するまでは0を維持し、最小値 V_{DL} を越えると増加し始め、参照定電圧 V_{REFH1} に達すると I_0 /2となり、その後も入力信号 V_{IN} の電圧増加に応じて増加し、最大値 V_{DH} で I_0 に達して飽和する。

この時点では、第1の差動増幅器15Aが加えられていないため、奇関数に負 10 の傾きの1次関数を加算した形になっている。

よって、差動増幅器15 C及び15 Dと同じ構成であり、最小値 V_{AL} 及び最大値 V_{AH} の幅を広く設定した第1 の差動増幅器15 Aの出力電流を加算することによって、1 次関数を相殺することができる。

すなわち、差動増幅器 15 Aに供給される通電電流値及び抵抗 RA_1 、 RA_2 を調整し、1 次関数領域の広さや傾きを最適化することで、入出力特性を前述した図 8 で二点鎖線図示のように最小値 V_{AL} を第 3 の差動増幅器 V_{CL} と一致させ、且の最大値 V_{AH} を第 4 の差動増幅器 15 Dの最大値 V_{CH} と一致させることにより、1 次成分を持たない出力電流を得ることができる。

そしてさらに、差動増幅器15 C と同じ構成の差動増幅器15 E を加える。これは、5 次関数が、参照定電圧 V_{REFM} から非常に離れた入力電圧 V_{IN} の領域において、 V_{IN} に対して大きな傾きを持った出力であるという特徴を有しているので、その特徴を精度良く実現するために加えるものである。

すなわち、入力されている参照定電圧 V_{REFL2} を差動増幅器15Cに入力されている参照定電圧 V_{REFL1} より小さな値に設定することによって、通電電流値を大きくして、抵抗値を大きくすることにより、入力電圧 V_{IN} が最小値 V_{CL} より小さい範囲において入力電圧 V_{IN} に対してより急峻な傾きの出力電流を出すことが可能になる。同様に差動増幅器15Dと同じ構成の差動増幅器15Fに入力されている参照定電圧 V_{REFH2} を差動増幅器15Dに入力されている参照定電圧 V_{REFH1} よりも大きな値に設定することによって、通電電流値を大きくして、抵抗値を大き

10

25



くすることにより、入力電圧 V_{IN} が最大値 V_{DH} より大きい範囲において入力電圧 V_{IN} に対してより急峻な傾きの出力電流を出すことが可能になる。

以上のように5次成分発生回路の出力電流 I our は、差動増幅器15Aの出力は図9(c)、差動増幅器15B、15C、15Dの出力加算は図9(a)、差動増幅の15E、15Fの出力加算は図9(b)のようになり、全体を加算すると、図9(d)に示すように滑らかな5次関数電流出力 I our となる。したがって、図4に示すように、正転入力側に定電圧を供給し、且つ5次関数電流出力 I our を、可変利得増幅回路11を構成する負帰還に可変抵抗VRを介挿したオペアンプOPAの反転入力側に供給すると、このオペアンプOPAから反転した1次成分を含まない5次成分のみの出力V5ourを得ることができる。

よって、上記のように6つの差動増幅器を用いて、回路定数を適当に設定する ことで、1次成分のない、下記(9)式のような5次関数のみを発生することが できる。

 $V = B = 5 (V_{IN} - V_{REFM})^{5}$ (9)

また、この回路構成はn次の奇関数に適用することができ、差動増幅器15E、15Fに入力されている参照定電圧 V_{REFL2} 、 V_{REFH2} の値や、抵抗値 RE_1 、 RE_2 、 RF_1 、 RF_2 や、通電電流値を適宜設定したり、さらに差動増幅器を複数付け加えて抵抗値や参照定電圧や通電電流値を最適化させたりすることによって、下記(10)式のような出力を得ることができる。

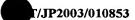
20 $V_{\text{NOUT}} = B_{\text{N}} (V_{\text{IN}} - V_{\text{REFM}})^{\text{n}}$ (10)

すなわち、一方の入力端子に共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所定レベルの定レベル信号が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反転信号を出力すると共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッタ機能を有する複数i個(iは5以上の整数)の差動増幅器と、前記i個の差動増幅器に前記定レベル信号を夫々供給する定レベル信号発生回路とを備え、前記i個の差動増幅器のうち第1、第2及び第3の差動増幅器は、入力される定レベル信号が順にレベルが高くなるように設定されると共に、前記第1及び第3の差動増幅器と前記第2の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、前記i個の差動増幅器のうち第4差動増幅器は、入力される定レベル信号が前

10

20

25



記第2の差動増幅器に入力される定レベル信号と同レベルの信号に設定されていると共に、その出力信号が前記第1及び第3の差動増幅器の出力信号と同極性で且つ前記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第2の差動増幅器のそれより大きく設定され、前記i個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器以外の(i-4)個の差動増幅器の夫々は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなる及び前記第3の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるの何れかに設定されていると共に、前記(i-4)個の差動増幅器と前記第2の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、前記第1、第2、第3及び前記(i-4)個の差動増幅器の出力信号を加算したときにk(kは7以上の奇数)次関数成分の出力信号を形成するように構成され、前記第4の差動増幅器は前記n次関数成分の1次成分を相殺するような1次成分の出力信号を形成するように構成され、前記第6の出力信号を形成するように構成され、前記第6の出力信号を形成するように構成され、前記第6の差動増幅器は前記n次関数成分の1次成分を相殺するような1次成分の出力信号を形成するように構成され、前記i個の差動増幅器の出力信号を加算することにより、1次成分を含まないk次関数成分を発生させるようにすればよい。

15 次に、偶関数出力回路の一例として、4次成分発生回路について説明する。 図10は、4次成分発生回路の一例である。

この4次成分発生回路は、正の電源端子VDDから定電流源13を介してゲート及びドレインを接続し、ソースをVSSに接地したMOS型電界効果トランジスタTrOを、このMOS型電界効果トランジスタTrOのゲートに各ゲートを接続した5個のMOS型電界効果トランジスタTr1~Tr5とを備えたカレントミラー回路14から定電流が引かれる定電流源回路を構成するMOS型電界効果トランジスタTr6と、これらの差動増幅器15A~15D及び定電流源回路の出力電流を加算する加算器としての同一抵抗値を有する抵抗16A、16Bとからなる。各差動増幅器15A~15Dには定レベル信号発生回路20で発生される異なる定レベルの参照電圧VREFH1、VREFH2、VREFH2及びVREFL1が供給される。

ここで、差動増幅器 15Aは、カレントミラー回路 140MOS型電界効果トランジスタ Tr1のドレインに夫々抵抗 RA_1 及び RA_2 を介して直列に接続された MOS 型電界効果トランジスタ TrA_1 及び TrA_2 を有する。トランジスタ

10

15

20

25



 TrA_1 のゲートに入力信号 V_{IN} が供給されると共に、トランジスタ TrA_2 のゲートに定レベルの参照電圧 V_{REFL1} が供給される。トランジスタ TrA_1 のドレインが加算器を構成する一方の抵抗16Bを介して正の電源端子VDDに接続され、トランジスタ TrA_2 のドレインがMOS型電界効果トランジスタ17及び加算器を構成する他方の抵抗16Aを介して正の電源端子VDDに接続されている。

そして、差動増幅器15B、15C、15Dも構成は等しく、トランジスタT rB_2 、 TrC_2 、 TrD_2 の夫々のゲートに定レベル信号発生回路20で発生される参照定電圧 V_{REFH1} 、 V_{REFL2} 、 V_{REFH2} が供給されるものとする。但し、差動増幅器15B、15Dは差動増幅器15A、15Cと逆特性に設定されているとする。

また、参照定電圧は $V_{REFH2} > V_{REFH1} > V_{REFL1} > V_{REFL2}$ であり、トランジスタTrC、TrDを流れる電流値をトランジスタTrA、TrBより大きい値に設定する。例えば $I_A = I_B = I_0$ 、 $I_C = I_D = 2I_0$ とする。

また、入力電圧 V_{IN} が4次関数の変曲点 x_0 、すなわち参照定電圧 V_{REFL1} と V_{REFH1} の中間にあるときの出力電流 I_{OUT} は、 $I_{OUT} = I_{POUT} - I_{NOUT} = 2I_0 + I_0 + I_0 + 2I_0 = 6I_0$ となり、出力の0次成分になってしまう。よって、この0次成分を相殺するために $6I_0$ を定電流として引く回路を加える。これは夫々の差動増幅器 $15A\sim15$ Dに定電流を供給しているカレントミラー回路 14 から作ることができる。このとき、カレントミラー回路 14 のMOS型電界効果トランジスタ T_T 1~ T_T 5 に、そのゲートに入力電圧 V_{IN} を入力しているもう 1つのMOS型電界効果トランジスタ T_T 6 を介して、加算器を構成する他方の抵抗 16Aを接続すると、カレントミラー回路 14 を構成しているMOS型電界効果トランジスタ T_T 6 のソースードレイン電圧が他のMOS型電界効果トランジスタ T_T 7 のソースードレイン電圧が他のMOS型電界効果トランジスタ T_T 6 のソースードレイン電圧が他のMOS型電界効果トランジスタ T_T 7 のソースードレイン電圧がものMOS型電界効果トランジスタ T_T 7 のソースードレイン電圧と近くなり、より精度の良い出力を得

20



ることができる。

この定電流回路からの出力電流は図11(c)のようになる。これらの電流出力を全て加算すると、図11(d)のような4次関数電流出力I our を得る。この電流出力I our を、図4に示したように、正転入力側に定電圧発生回路10で発生した定電圧V off を供給し、且つ可変利得増幅回路11を構成する負帰還に可変抵抗V Rを介挿したオペアンプO P A の反転入力側に供給すると、このオペアンプO P A より電流出力を反転した、4次成分のみの出力V 4 our を得ることができる。

よって、上記のように4つの差動増幅器15A~15D及び定電流回路を用い 10 て、回路定数を適宜設定することで、下記(11)式のような0次成分のない、 4次関数のみを発生することができる。

 $V = B = (V_{IN} - V_{REFM})^4 \dots (1 1)$

また、この回路構成はm次の偶関数に適用することができ、差動増幅器 15A ~ 15Dに入力されている参照定減圧 V_{REFL1} 、 V_{REFL2} 、 V_{REFH1} 、 V_{REFH2} の値や、抵抗 RA_1 ~ RD_2 や、通電電流値を適宜設定したり、さらに差動増幅器を複数付け加えて抵抗値や参照定電圧や通電電流値を最適化させたりすることによって、下記(12)式のような出力を得ることができる。

 $V_{mOUT} = B_m (V_{IN} - V_{REFM})^m \dots (12)$

すなわち、一方の入力端子に共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所定レベルの定レベル信号が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反転信号を出力すると共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッタ機能を有する複数 j 個 (j は4以上の整数) の差動増幅器と、一定の出力信号を出力する一定信号出力回路と、前記 j 個の差動増幅器に前記定レベル信号を共々供給する定レベル信号発生回路とを備え、前記 j 個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器は、入力される定レベル信号が順にレベルが高くなるように設定されると共に、前記第1及び第2の差動増幅器と前記第3及び第4の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、前記 j 個の差動増幅器の出力信号を加算したときにm (mは6以上の偶数)次関数成分の出力信号を形成するように構成され、前記一定信号出力回路は、前記m次関数成分の

15

20

0次成分を相殺するような0次成分の出力信号を形成するように構成され、前記

j個の差動増幅器及び前記一定信号出力回路の出力信号を加算することにより、

0次成分を含まないm次関数成分を発生させるようにすればよい。

次に、補償温度範囲を高低どちらか一方に拡張した時の3次成分発生回路の改善 善例を述べる。温度範囲の拡張は温度検出回路1からの出力電圧の範囲が広くなる、即ち3次成分生成回路の入力電圧の範囲が広がったことに相当する。

これまで知られている、 3次成分発生回路は、図12に示すように、正の電源端子VDDに定電流源13を介してゲート及びドレインを接続し、ソースをVSSに接地したMOS型電界効果トランジスタTr0と、このMOS型電界効果トランジスタTr0のゲートに各ゲートを接続した4個のMOS型電界効果トランジスタTr1~Tr4とを備えたカレントミラー回路14と、このカレントミラー回路14と、このカレントミラー回路14から定電流が供給される第1~第4の増幅器を構成する4個の差動増幅器15A~15Dと、これらの差動増幅器15A~15Dの出力電流を加算する加算器を構成する同一抵抗値を有する抵抗16A,16Bとから構成されている。各差動増幅器15A~15Dには異なる定レベルの参照電圧 V_{REFM} 、 V_{REFM}

ここで、差動増幅器 15 Aは、カレントミラー回路 14 のMO S型電界効果トランジスタT r 1 のドレインに夫々抵抗 R A_1 及び R A_2 を介して直列に接続された M O S型電界効果トランジスタT r A_1 及びT r A_2 を有する。トランジスタT r A_1 のゲートに入力信号 V_{IN} が供給されると共に、トランジスタT r A_2 のゲートに定レベルの参照電圧 V_{REFM} が供給さる。トランジスタT r A_1 のドレインが加算器を構成する一方の抵抗 16 A及び差動増幅器 12 の出力をゲートで受ける M O S型電界効果トランジスタ 17 を介して正の電源端子 V D D に接続され、トランジスタT r A_2 のドレインが加算器を構成する他方の抵抗 16 B を介して正の電源端子 V D D に接続されている。

差動増幅器 15Bも同様に、カレントミラー回路 140MOS型電界効果トランジスタTr1のドレインに夫々抵抗 RB_1 及び RB_2 を介して直列に接続されたMOS型電界効果トランジスタ TrB_1 及び TrB_2 を有する。トランジスタ TrB_1 のゲートに入力信号 V_{IN} が供給されると共に、トランジスタ TrB_2 のゲー

. 15

25



トに定レベルの参照電圧 V_{REFM} が供給される。しかし、前述した差動増幅器 15 Aとは逆にトランジスタTr B $_1$ のドレインが加算器を構成する他方の抵抗 16 Bを介して正の電源端子VDDに接続され、トランジスタTr B $_2$ のドレインがM OS型電界効果トランジスタ 17 及び加算器を構成する一方の抵抗 16 Aを介して正の電源端子VDDに接続されることにより、他の差動増幅器 15 A、15 C 及び 15 Dとは逆特性に設定されている。

差動増幅器 15C, 15Dは、差動増幅器 15Aの構成と等しく、但し、それぞれの有するトランジスタ TrC_1 , TrD_1 のゲートに入力信号 V_{IN} が供給されると共に、トランジスタ TrC_2 , TrD_2 のゲートに定レベルの参照電圧 V_{REFL}

10 , V_{REFH}が供給される。

差動増幅器 1 5 Aの出力電流 I out は、図 1 3 (a) に示すようになり、同じく差動増幅器 1 5 Bの出力電流 I out は図 1 3 (b)、差動増幅器 1 5 Cの出力電流 I out は図 1 3 (c)、差動増幅器 1 5 Dの出力電流 I out は図 1 3 (d) となる。全体の出力電流は上記の各出力電流 I out が加算されたものであるので、図 1 3 (e) に示すような結果となる。この出力電流は可変利得増幅回路 1 1 を構成する負帰還に可変抵抗 V R を介挿したオペアンプ O P Aの反転入力側に供給し、このオペアンプ O P Aの正転入力側に定電圧が供給され、1 次成分を含まない 3 次成分のみの下記 (13) 式で表される出力 V 3 out を得ることができる。

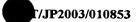
 $V 3_{OUT} = B 3 (V_{IN} - V_{OFF})^3 \dots (1 3)$

20 ここで、係数B3は3次成分発生回路のゲイン及び可変利得増幅器11の利得に よって決定される。

しかし、例えば、入力電圧の範囲を高い側にのみ拡張したい場合、上記の3次関数発生回路では、図13(e)に示したように、入力電圧 V_{IN} が高いところで3次関数発生回路から大きくずれる。それは差動増幅器15Dの出力が飽和するからである。

このため、参照定電圧VREFHが入力されている差動増幅器15Dの出力を補正する必要が生じる。

ここで、参照定電圧V_{REFH2} を入力する、差動増幅器15 Eを加える。この改良 した3次成分発生回路を図14に示す。但し、参照定電圧V_{REFH2} > V_{REFH}に設定



されている。また、差動増幅器 15C, 15D, 15Eの通電電流 I_{CO} , I_{DO} , I_{EO} は $I_{CO} = I_{DO} + I_{EO}$ となるように設定すると、O次成分を相殺できる。

先ず、差動増幅器 15A, 15B及び 15Cは同じ構成なので、出力はそれぞれ図 15 (a)、図 15 (b) 及び図 15 (c) のようになる。そして、差動増幅器 15Dの出力は図 15 (d) の実線のようになり、差動増幅器 15Eの出力は図 15 (d) のようになる。差動増幅器 15Dの出力が飽和する付近で、差動増幅器 15E0出力電流を加算すると、補正入力電圧 V_{IN} が高いところで 3 次関数発生回路から大きくずれることの補正が可能となり、全て加算した出力結果は、図 15 (e) のようになる。

10 よって、それぞれの増幅器の抵抗値 RD_1 , RD_2 及び RF_1 , RF_2 や、参照 定電圧 V_{REFH} , V_{REFH2} を適宜設定することにより、入力電圧 V_{IN} の範囲を高い方 にのみ広げた時によりよい 3 次関数を得る 3 次成分発生回路を構成することができる。

また、1次成分発生部 6 Aは、図 1 6 に示すように、入力信号 V_{IN} が入力される 入力端子 t_{IN} と参照定電圧入力端子 t_R との間に接続された可変抵抗 V_R と、この可変抵抗 V_R の摺動子が正転入力側に、参照定電圧入力端子 t_R が抵抗 R_1 を介して反転入力側に夫々供給され、且つ出力信号が抵抗 R_2 を介して反転入力側に帰還される正転増幅器とで構成され、参照定電圧入力端子 t_R に前記 3 次成分発生回路の参照定電圧 V_{REFM} が供給されている。

20 この 1 次成分発生部 6 Aによると、入力信号 V_{IN} が正転増幅器 2 O で増幅されることになり、この正転増幅器 2 O の出力電圧 V_{BOUT} は次式で表すことができる

 $VB_{OUT} = B1 \quad (V_{IN} - V_{REFM}) \qquad \cdots \qquad (14)$

ここで、係数変数B1 は可変抵抗VRの設定値及び正転増幅器20の利得によ 25 って決定される。

前述した図1に戻って、この図1は、本発明の温度補償水晶発振回路の一例を表している。この中で使用される水晶振動子は、温度に対して、図17のような発振周波数の温度特性を有する。この特性は一般的に、下記(15)式のような多項式によって表すことができる。

10

15

20



この特性は、水晶振動子及び電圧制御水晶発振回路の特性に依存する。また、現在広く適用されている電圧制御水晶発振回路の電圧一周波数特性は1次関数で近似できるので、水晶振動子の温度に対する周波数特性は、温度に対する電圧特性で実現できる。したがって、図1の実施形態において、(15)式における右辺の項に相当する電圧を温度検出回路1の温度検出信号に基づいて、近似n次関数発生装置2で発生させ、各次数の係数ao~anの固体間バラツキを夫々のn次成分発生部における可変利得増幅回路11により利得調整を行い、微調整をし、微調整後の各電圧を加算回路で加算し、水晶振動子の温度に対する周波数特性に対応した電圧制御水晶発振回路の制御電圧を得ることができ、この制御電圧を電圧制御水晶発振回路3に供給することにより、これに含まれる水晶振動子の温度依存性を正確に補償することができる。

具体的には図1における近似n次関数発生装置2と、電圧制御水晶発振器(VCXO)3とを切り離した状態で恒温槽に格納し、この恒温槽の温度を、温度補償を行いたい範囲内の任意の温度 t1に設定する。恒温槽の温度が設定温度 t1に安定した状態で、電圧制御水晶発振器3の入力電圧VCINを変化させて出力信号の周波数が予め設定された周波数に一致する周波数となる入力電圧VCIN(t1)を測定すると共に、近似n次成分発生装置2の出力電圧VCOUTn(t1)を各次数ごと個別に測定する。すなわち、他の次数成分の利得が零となるように設定し、1つの成分のみの出力が得られる状態にして厳密に測定する。よって、近似n次関数発生装置2の出力電圧として、n次~3次及び1次と0次のデータをとることになる。

以上の測定処理を恒温槽の設定温度を順次異なる温度にしながら複数回以上繰り返すことにより、各設定温度($t_1 \sim t_m$)での電圧制御水晶発振器 3 の入力電 $EVC_{IN}(t_1) \sim VC_{IN}(t_m)$ を測定すると共に、近似 n 次関数発生装置 2 の出力電圧 $VC_{OUT}(t_1) \sim VC_{OUT}(t_m)$ を測定する。

次いで、近似 n 次関数発生装置 2 の出力電圧V C OUTn (t_1) \sim V C OUTn (t_m) から夫々 O 次成分V C OUTO (t_1) \sim V C OUTO (t_m) を差し引いたものを下記(1 6)式のように温度の関数に近似する。何故ならば、近似 n 次関数発生装置 2 の出力電圧V C

20



OUTnには、0次成分発生部で発生される0次成分VCouToが含まれてしまうので、この0次成分(オフセット)を引くことで、より正しいn次成分VCouTnが得られ、より高精度の調整が可能になる。この時、近似する関数には制約がなく、データに合わせて任意に決定することができる。また、各次数のデータを個別にとることで、調整のための情報が増え高精度の調整が可能になる。

 $V C_{OUT_n}'(t) \equiv V C_{OUT_n}(t) - V C_{OUT_0}(t) \qquad \dots \qquad (1.6)$

この後、各々の温度で、下記(17)式に示す関数 $VC_{OUT}(t)$ が、測定した入力電圧 $VC_{IN}(t_1)\sim VC_{IN}(t_m)$ と一致するように係数 $\alpha_n\sim\alpha_0$ 及び Δ t を調整することにより、温度補償を行う。

10 $V C_{OUT}(t) = \alpha_n V C_{OUTn'}(t + \Delta t) + \cdots$

$$+\alpha_3 \text{ VC}_{\text{OUT3}'} (t + \Delta t) + \alpha_1 \text{ VC}_{\text{OUT1}'} (t + \Delta t)$$

 $+ \text{VC}_{\text{OUT0}'} (t + \Delta t) + \alpha_0 \dots (17)$

具体的には、n次成分発生部に設けた可変利得増幅回路 1 1 により係数 α_n を得るような利得調整を行い、0次成分は加算回路のところで係数 α_0 を得るような定電圧値を加算することで調整する。補正値 Δ t に関しては、温度検出回路 1 のオフセットを調節することで調整する。

制御水晶発振器3の入力電圧VCIN及び温度補償回路出力電圧即ち近似n次関数発生装置2の各次数の出力電圧VCOUTn~VCOOUToを夫々測定し、これらの測定結果に基づいて近似n次関数発生装置2を調整することにより、一度の温度スイープ作業により、高精度の温度補償を行うことができる。

以上から分かるように、前述した(5)式のような記述を用いると、その関数の出力電圧を発生する近似n次関数発生装置を実現しやすく、例えば水晶発振器の温度補償回路として用いる場合にも上記の構成は調整が容易である。また、夫々の次数成分発生装置は、奇関数、偶関数共に、上記の構成にて精度良く設計することが可能である。また、上記の調整方法を用いることで、これまでに知られている近似3次関数発生装置ばかりか、 $n \ge 4$ における近似n次関数発生装置2においてもより精度良く調整することができる。

同様に、図2に示す近似5次関数発生装置2Aを適用した温度補償水晶発振回 路でも上記と同様の調整方法を行うことで、近似5次関数に特化した温度補償水

20



晶発振回路で高精度の温度補償を行うことができる。

さらに、図3に示す近似4次関数発生装置2Bを適用した温度補償水晶発振回路でも上記と同様の調整方法を行うことで、近似4次関数に特化した温度補償水晶発振回路で高精度の温度補償を行うことができる。

なお、上記各実施形態においては、近似n次関数発生回路で、MOS型電界効果トランジスタを用いた場合について説明したが、これに限定されるものではなく、バイポーラトランジスタ等の他の能動素子を適用してもよい。

また、上記各実施形態においては、グランド基準である場合について説明したが、これに限定されるものでなはく、VDD基準とすることも可能である。

10 さらに、各次数成分発生回路からの出力を電流出力とした場合について説明したが、これに限定されるものではなく、電圧出力とすることももちろん可能である。

産業上の利用の可能性

15 上記n次関数発生装置を採用することにより、高精度のn次関数を発生させる ことができ、このn次関数発生装置を温度補償水晶発振回路に適用することによ り、高精度の温度補償を行うことができる。

また、上記温度補償調整方法を採用することにより、高精度の温度補償が可能となると共に、各次数を個別に測定することにより、詳しく正確なデータの取得が可能となり、実際のデータを基にすることで、各次数成分以外のエラーなども考慮して、より最適な係数の算出が可能となり、さらに一度の温度スイープによってこれまで知られている近似3次関数発生部ばかりか、n≥4における近似n次関数発生部においても、温度補償の調整を精度よく行うことができる。

15

20

25



請求の範囲

1. 一方の入力端子に共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所定レベルの定レベル信号が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反転信号を出力すると共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミック機能を有する複数i個(iは5以上の整数)の差動増幅器と、

前記i個の差動増幅器に前記定レベル信号を夫々供給する定レベル信号発生回路とを備え、

前記i個の差動増幅器のうち第1、第2及び第3の差動増幅器は、入力される 定レベル信号が順にレベルが高くなるように設定されると共に、前記第1及び第 3の差動増幅器と前記第2の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され

前記i個の差動増幅器のうち第4差動増幅器は、入力される定レベル信号が前 記第2の差動増幅器に入力される定レベル信号と同レベルの信号に設定されてい ると共に、その出力信号が前記第1及び第3の差動増幅器の出力信号と同極性で 且つ前記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第2の 差動増幅器のそれより大きく設定され、

前記i個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器以外の(i-4)個の差動増幅器の夫々は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなる及び前記第3の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるの何れかに設定されていると共に、前記(i-4)個の差動増幅器と前記第2の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、

前記第1、第2、第3及び前記(i-4)個の差動増幅器の出力信号を加算したときにk(kは3以上の奇数)次関数成分の出力信号を形成するように構成され、

前記第4の差動増幅器は前記n次関数成分の1次成分を相殺するような1次成分の出力信号を形成するように構成され、

前記 i 個の差動増幅器の出力信号を加算することにより、1次成分を含まない k 次関数成分を発生させることを特徴とする k 次成分発生回路。

10

25

- 2. i = 5且のk = 3に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の3次成分発生回路。
- 3. 第5の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなるように設定され且つ前記最大値となる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第1の差動増幅器のそれより小さく設定されていることを特徴とする請求項2に記載の3次成分発生回路
- 4. 第5の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第3の差動増幅器に 入力される定レベル信号のレベルより高くなるように設定され且つ前記最大値と なる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第3の差動増幅器のそれ より小さく設定されていることを特徴とする請求項2に記載の3次成分発生回路
 - i=6及びk=5に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の5次成分発生回路。
- 15 6. 第5の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に 入力される定レベル信号のレベルより低くなるように設定され且つ前記最大値と なる入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第1の差動増幅器のそれ より小さく設定され、

第6の差動増幅器は、入力される定レベル信号が前記第3の差動増幅器に入力 20 される定レベル信号のレベルより高くなるように設定され且つ前記最大値となる 入力信号と前記最小値となる入力信号との幅が前記第3の差動増幅器のそれより 小さく設定されていることを特徴とする請求項5に記載の5次成分発生回路。

- 7. 一方の入力端子に共通の1次の入力信号が入力され、他方の入力端子に所 定レベルの定レベル信号が入力され、前記1次の入力信号に対して反転又は非反 転信号を出力すると共に、出力信号を所定の最大値及び最小値で制限するリミッ タ機能を有する複数 j 個 (j は 4 以上の整数) の差動増幅器と、
 - 一定の出力信号を出力する一定信号出力回路と、

前記j個の差動増幅器に前記定レベル信号を夫々供給する定レベル信号発生回路とを備え、



前記 j 個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器は、入力される定レベル信号が順にレベルが高くなるように設定されると共に、前記第1及び第2の差動増幅器と前記第3及び第4の差動増幅器との出力信号が互いに逆極性に設定され、

5 前記 j 個の差動増幅器の出力信号を加算したときにm (mは4以上の偶数) 次 関数成分の出力信号を形成するように構成され、

前記一定信号出力回路は、前記m次関数成分の0次成分を相殺するような0次成分の出力信号を形成するように構成され、

前記 j 個の差動増幅器及び前記一定信号出力回路の出力信号を加算することに 10 より、0次成分を含まないm次関数成分を発生させることを特徴とするm次成分 発生回路。

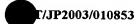
- 8. jが6以上の偶数であって、j個の差動増幅器のうち第1、第2、第3及び第4の差動増幅器以外の(j-4)の差動増幅器の夫々は、入力される定レベル信号が前記第1の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより低くなる及び前記第4の差動増幅器に入力される定レベル信号のレベルより高くなるの何れかに設定されていることを特徴とする請求項7に記載のm次成分発生回路。
- 9. j=4且つm=4に設定されていることを特徴とする請求項7に記載0.4次成分発生回路。
- 10. 一定の信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、
- 20 1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力されるk(kは3以上の奇数)次成分発生回路及び 該k次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利得増幅回路を有する少 なくとも1つ以上のk次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力されるm (mは4以上の偶数)次成分発生回路及び 25 該m次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する少 なくとも1つ以上のm次成分発生部と、

前記 0 次成分発生部、前記 1 次成分発生部、前記 k 次成分発生部及び前記m次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備え、近似n (nは4以上の整数) 次関数を発生することを特徴とする近似n次関数発生装置。

20



11. 一定の信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、

1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項1に記載の k (kは3以上の奇数

-) 次成分発生回路及び該 k 次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利
- 5 得増幅回路を有する少なくとも1つ以上のk次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項7に記載のm(mは4以上の偶数

)次成分発生回路及び該m次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利 得増幅回路を有する少なくとも1つ以上のm次成分発生部と、

前記 0 次成分発生部、前記 1 次成分発生部、前記 k 次成分発生部及び前記m次 10 成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備え、近似 n (nは4以上の整数) 次関数を発生することを特徴とする近似 n 次関数発生装置。

12. 一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、 1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の 3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利 得増幅回路を有する3次成分発生部と、

前記0次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記3次成分発生部の出力信号 を加算する加算回路とを備えていることを特徴とする近似3次関数発生装置。

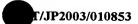
13. 一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、

1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の 3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利 得増幅回路を有する3次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項9に記載の4次成分発生回路及び 25 該4次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する4 次成分発生部と、

前記4次成分発生部、前記3次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記0次 成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備えていることを特徴とする近似 4次関数発生装置。



14. 一定の入力信号が入力されて定数成分を発生する0次成分発生部と、 1次の入力信号が入力されて1次成分を発生する1次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項2乃至請求項4の何れかに記載の 3次成分発生回路及び該3次成分発生回路の出力信号が入力される第1の可変利 5 得増幅回路を有する3次成分発生部と、

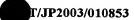
前記1次の入力信号が入力される上記請求項9に記載の4次成分発生回路及び該4次成分発生回路の出力信号が入力される第2の可変利得増幅回路を有する4次成分発生部と、

前記1次の入力信号が入力される上記請求項5又は請求項6に記載の5次成分 10 発生回路及び該5次成分発生回路の出力信号が入力される第3の可変利得増幅回 路を有する5次成分発生部と、

前記5次成分発生部、前記4次成分発生部、前記3次成分発生部、前記1次成分発生部及び前記0次成分発生部の出力信号を加算する加算回路とを備えていることを特徴とする近似5次関数発生装置。

- 15 15. 1次の入力信号が入力され、n次多項式により表されるn次関数に比例 するn次の出力信号を出力し、前記n次多項式は2次の項を含まないことを特徴 とする近似n次関数発生装置。
 - 16. 温度検出回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される上記請求項1 5に記載の近似n次関数発生装置とを備えたことを特徴とする温度関数発生回路
 - 17. 上記請求項16に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似n次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴とする温度補償水晶発振回路。
- 18. 温度検出回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項1 25 O又は11に記載の近似n次関数発生装置とを備えたことを特徴とする温度関数 発生回路。
 - 19. 上記請求項18に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似n次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴とする温度補償水晶発振回路。

15



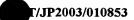
- 20. 温度検出回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項1 2に記載の近似3次関数発生装置とを備えたことを特徴とする温度関数発生回路
- 21. 上記請求項20に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発 生される近似3次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴とする温 度補償水晶発振回路。
 - 22. 温度検出回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項1 3に記載の近似4次関数発生装置とを備えたことを特徴とする温度関数発生回路
- 10 23. 上記請求項22に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似4次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴とする温度補償水晶発振回路。
 - 24. 温度検出回路と、該温度検出回路の検出信号が入力される前記請求項14に記載の近似5次関数発生装置とを備えたことを特徴とする温度関数発生回路
 - 25. 上記請求項24に記載の温度関数発生回路と、該温度関数発生回路で発生される近似5次関数が入力される水晶発振回路とを備えたことを特徴とする温度補償水晶発振回路。
- 26. 温度検出回路及び近似n(nは3次以上の整数)次関数発生装置を備え 20 る温度補償回路と、電圧制御水晶発振回路とから構成される温度補償水晶発振回 路において、前記温度補償水晶発振回路の温度補償調整を行う際に、

所定の温度雰囲気内で、前記温度補償回路の出力電圧VC_{out}のn次成分VC_{outn} 乃至 O 次成分VC_{outn}を測定すると共に、

前記電圧制御水晶発振回路から出力される発振周波数が予め設定された選定周波 数に一致する入力電圧VC_{IN}を所望の温度補償範囲内における複数の温度で測定 し、

測定した各温度の出力電圧 VC_{out} のn次成分 VC_{outn} を温度Tの関数として、 VC_{outn} '(T)= VC_{outn} (T) $-VC_{outn}$ (T)

で近似し、前記出力電圧VCℴℴ を温度Tの関数として、



で表記し、

前記測定された各温度の入力電圧 VC_{IN} と前記出力電圧 VC_{OUT} とが夫々の温度において一致するように、前記温度補償回路の係数 $\alpha_n \sim \alpha_3$ 、 α_1 、 α_0 及び Δ Tを調整するようにしたことを特徴とする温度補償調整方法。

図 1

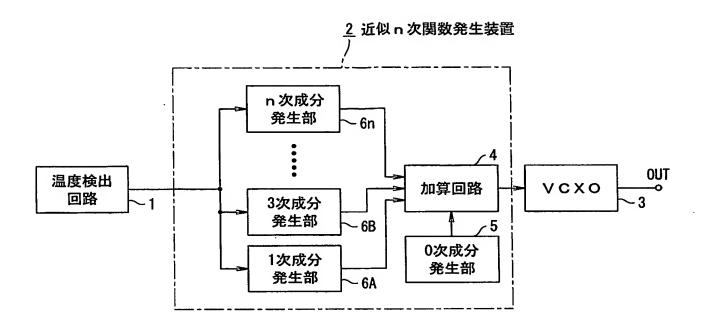


図2

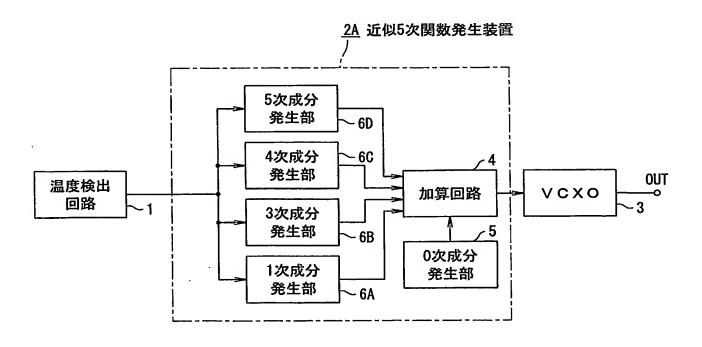
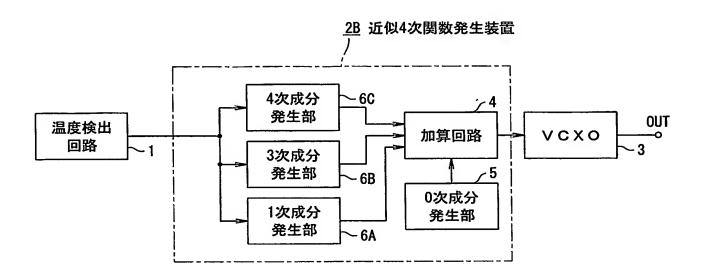


図3



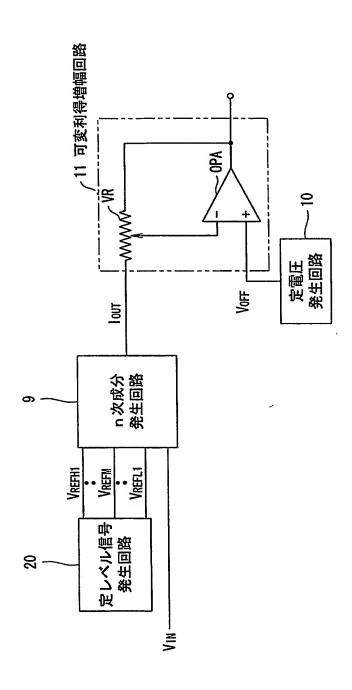
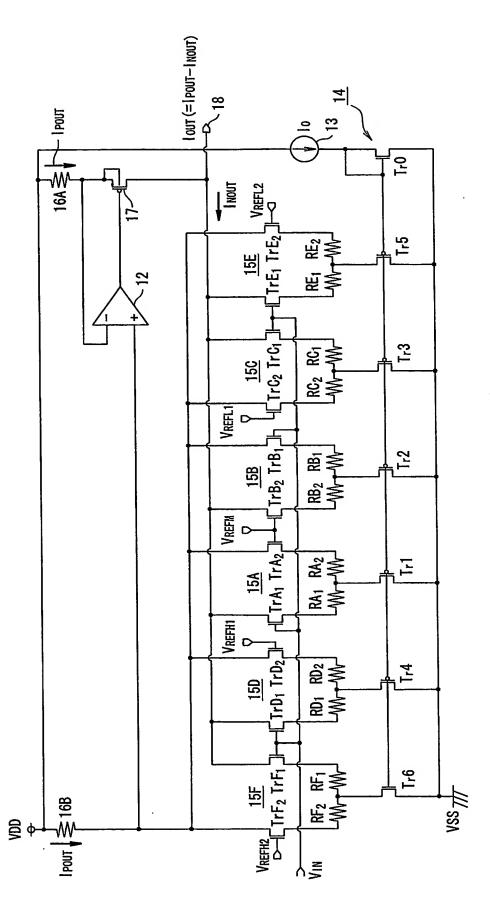
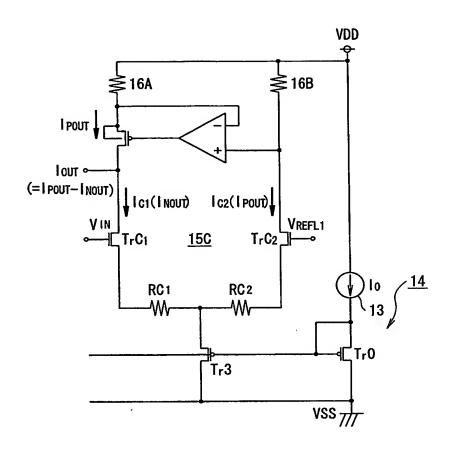
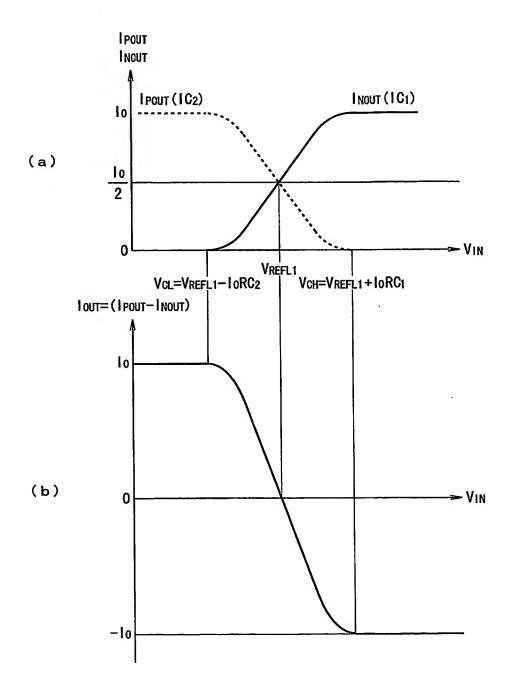
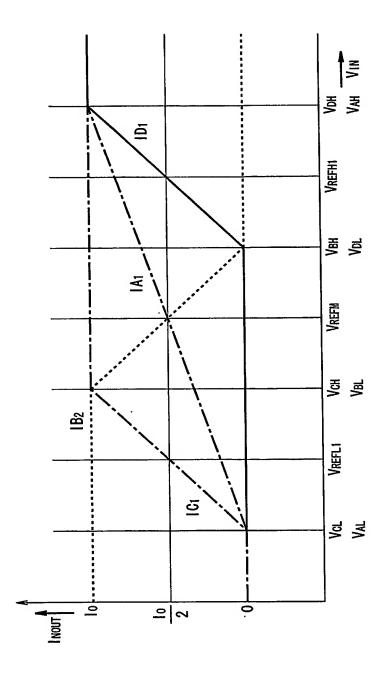


図5









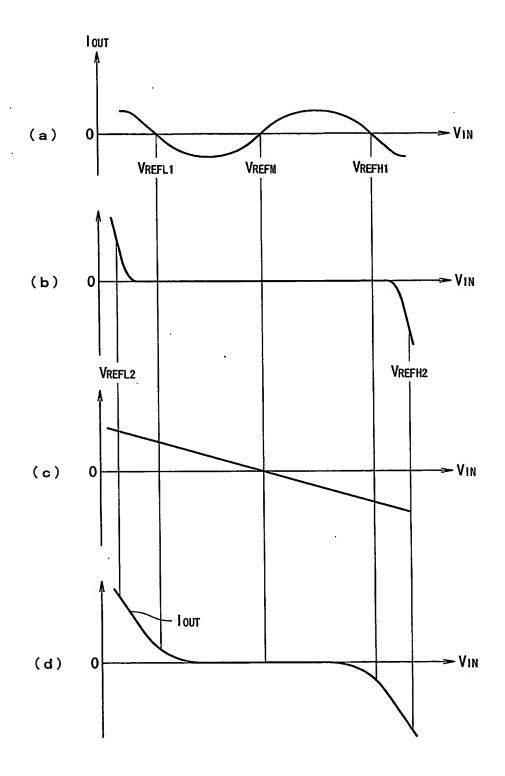


図10

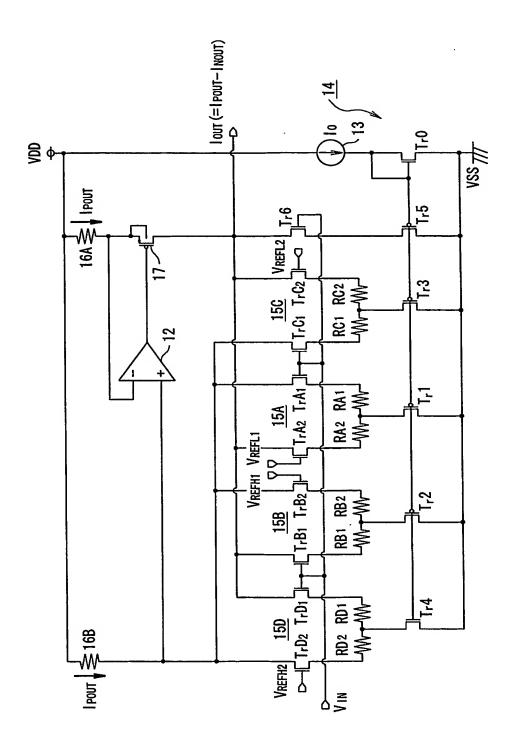


図11

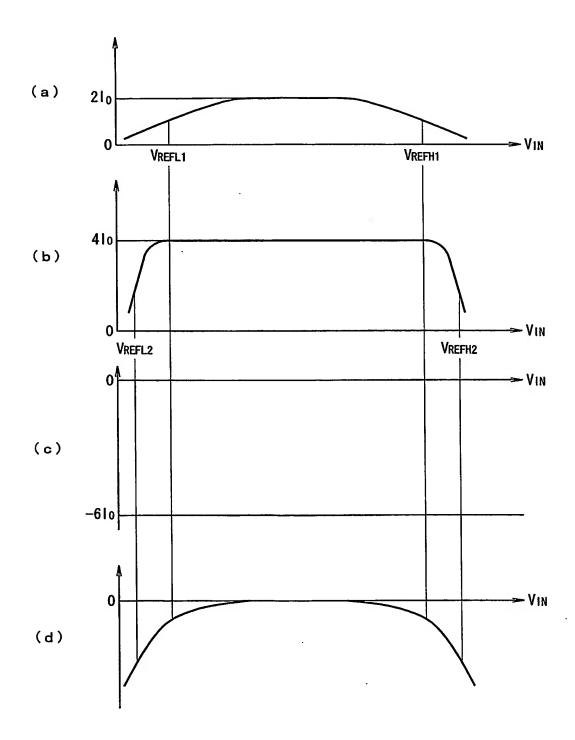


図12

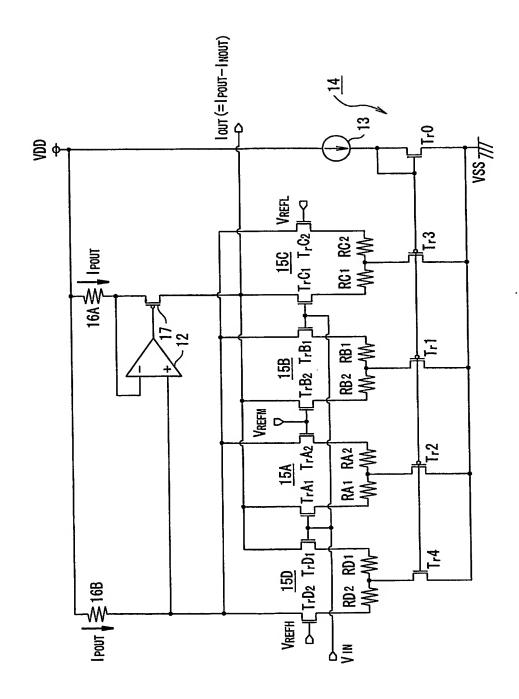


図13

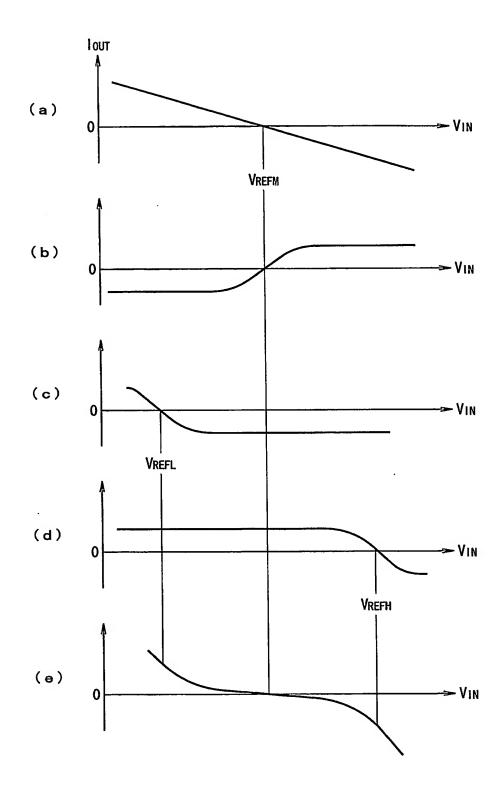


図14

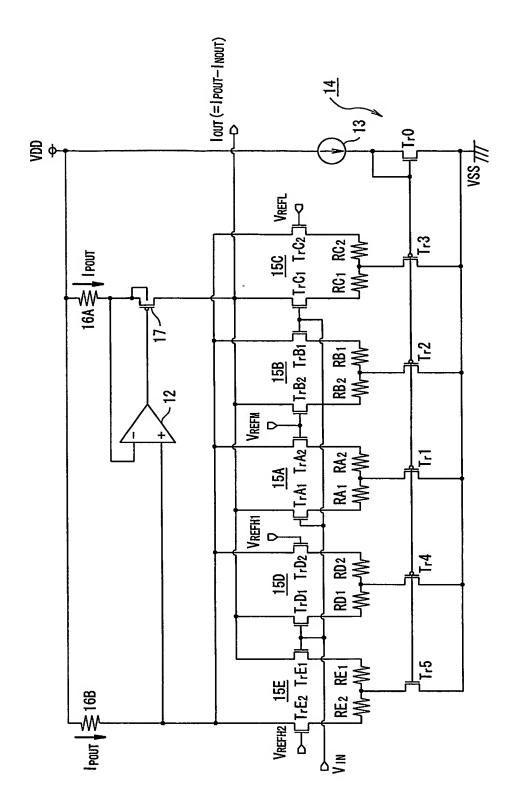


図15

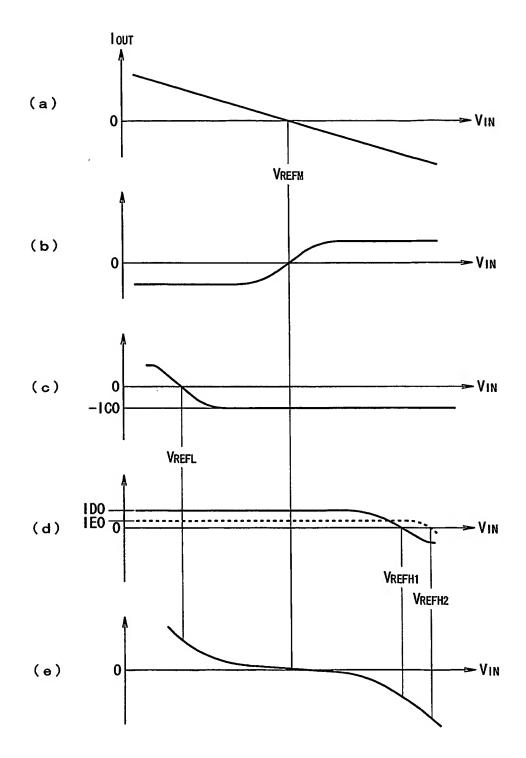


図16

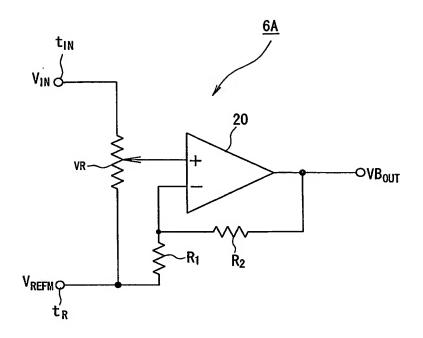


図17

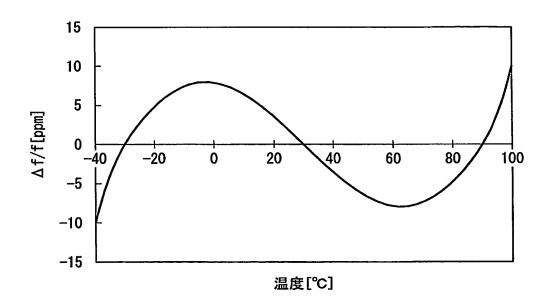


図18

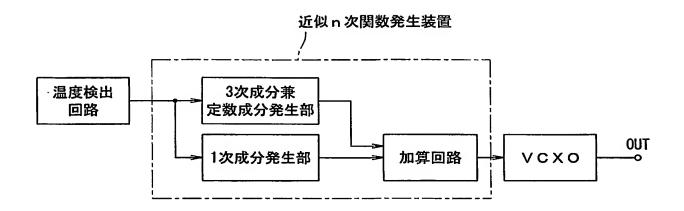


図19

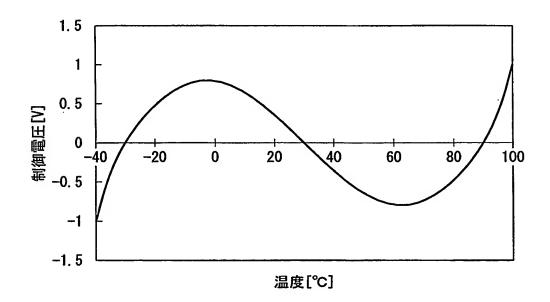


図20

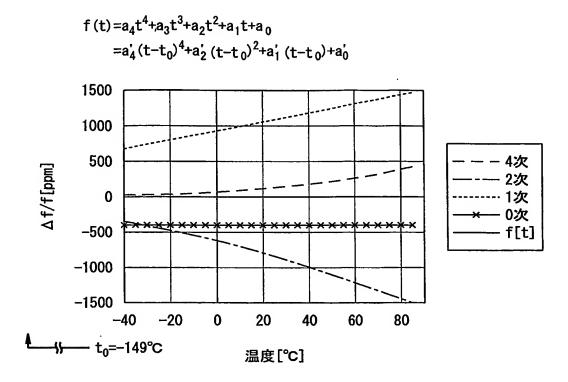
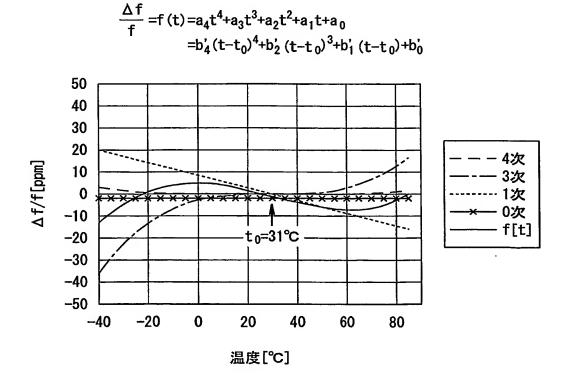


図21





International application No.
PCT/JP03/10853

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| Int.Cl ⁷ H03B5/32, G01G7/20 | | | | | |
| | | | | | |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | |
| | SEARCHED | | | | |
| Minimum do | ocumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ H03B5/32, G01G7/20 | y classification symbols) | | | |
| int. | CI NUSBS/32, GUIG//20 | | | | |
| | | | | | |
| | ion searched other than minimum documentation to the | extent that such documents are included | in the fields searched | | |
| | Jitsuyo Shinan Koho 1922—1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994—2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996—2003 | | | | |
| | • | | | | |
| | ata base consulted during the international search (name L, JOIS | ot data base and, where practicable, sear | en terms asea) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C. DOCU | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where app | | Relevant to claim No. | | |
| Y | · | Microsystems Co., | 1-14,18-26 15-17 | | |
| Х | Ltd.), 10 December, 1998 (10.12.98), | | 131 | | |
| 7 | Full text; all drawings | 2341020 B | · | | |
| | & US 6584380 B1 & GB & CN 1257619 A | | | | |
| | | and dwardwar annound | 1-26 | | |
| Y | Microfilm of the specification to the request of Japanese Uti | | 1-20 | | |
| | No. 65046/1987 (Laid-open No. | | | | |
| | (Kinseki Kabushiki Kaisha), 11 November, 1988 (11.11.88), | | | | |
| | Page 2, line 9 to page 3, line 2; Fig. 2 | | | | |
| | | | | | |
| | | • | | | |
| | | | | | |
| | | • | | | |
| X Furth | ler documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | <u> </u> | | |
| * Specia | al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not | "T" later document published after the int priority date and not in conflict with t | he application but cited to | | |
| consid | considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention | | | | |
| date | date considered novel or cannot be considered to involve an inventive | | | | |
| cited t | cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be | | | | |
| "O" docun | "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such | | | | |
| means "P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed | | | | | |
| Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report | | | | | |
| 02 1 | December, 2003 (02.12.03) | 16 December, 2003 | (10.12.03) | | |
| The same and manning are the same and the | | Authorized officer | | | |
| Japanese Patent Office | | | | | |
| Facsimile No. | | Telephone No. | | | |



International application No.
PCT/JP03/10853

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| Y | JP 5-347512 A (Meidensha Corp.), 27 December, 1993 (27.12.93), Page 6, left column, lines 38 to 29; Fig. 2 (Family: none) | 1-26 |
| Y | JP 8-116214 A (Fujitsu Ltd.), 07 May, 1996 (07.05.96), Full text; all drawings (Family: none) | 1-26 |
| Y | JP 11-68461 A (Toyo Communication Equipment Co., Ltd.), 09 March, 1999 (09.03.99), Full text; all drawings (Family: none) | 1-26 |
| Y | JP 2002-141426 A (Daishinku Corp.), 17 May, 2002 (17.05.02), Page 2, right column, lines 39 to 45 (Family: none) | 1-26 |
| A | Kenji NEMOTO, "Analogue-hoshiki CMOS TCXO", Heisei 13 Nen Proceedings of the Electronics, Information and Systems Conference, 06 September, 2001 (06.09.01), p.II-219 | 1-26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ H03B 5/32 G01G 7/20 | | | | | |
|---|---|---|------------------------|--|--|
| B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ H03B 5/32 G01G 7/20 | | | | | |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 | | | | | |
| 国際調査で使用 WPI/L | 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) WPI/L, JOIS | | | | |
| | 5と認められる文献 | | I nost | | |
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると | ささは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 | | |
| Y X | WO 98/56105 A1 (旭(社) 1998. 12. 10, 全文, 至 0 B1 & GB 234102019 A | È図 & US 658438 | 1-14, 1 $8-26$ $15-17$ | | |
| Y | 日本国実用新案登録出願62-650 出願公開63-173909号)の原 の内容を撮影したマイクロフィルム 8.11.11,第2頁第9行-第3 | 頭書に添付した明細書及び図面 (キンセキ株式会社) 198 | 1-26 | | |
| 区 C欄の続き | きにも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリーに関する別 | 紙を参照。 | | |
| * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「A」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献 | | | | | |
| 国際調査を完 | 了した日 02.12.03 | 国際調査報告の発送日 16.12. | 03 | | |
| 日本 | の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 小林 正明 電話番号 03-3581-1101 | 5W 3248 内線 3534 | | |

| | . 関連すると認められる文献 | | | |
|-----------------|--|------------------|--|--|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 | | |
| Y | JP 5-347512 A (株式会社明電舎) 1993.12.27,第6頁左欄第38-39行,第2図(ファ ミリー) | 1-26 | | |
| Y | JP 8-116214 A (富士通株式会社) 1996.05.07,全文,全図 (ファミリーなし) | 1-26 | | |
| Y | JP 11-68461 A (東洋通信機株式会社) 1999.03.09,全文,全図(ファミリーなし) | 1-26 | | |
| Y | JP 2002-141426 A (株式会社大真空) 2002.05.17,第2頁右欄第39-45行、(ファミリーなし) | 1-26 | | |
| A | 根本謙治, アナログ方式CMOS TCXO 平成13年電気学会電子・情報システム部門大会講演論文集, 2001.09.06, p. II-219 | 1-26 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | 1 | | |